

Mulch-Channel Temperature Controlled High Voltage TDDB Test System



多チャンネル恒温高電圧
TDDB試験システム

IF-TD101

IF-TD101

多チャンネル恒温高電圧 TDDDB試験システム

Mulch-Channel Temperature Controlled High Voltage
TDDDB Test System



温度制御下にて最大96個のICへの高電圧TDDDB試験が可能。試験時間を大幅に短縮。

本システムでは、最大20kVの電圧を用いて、絶縁油中にある最大96個のICに対してTDDDB試験を実施することが可能です。TDDDB試験のTDDDBとは、Time Dependent Dielectric Breakdownの略で経時的酸化膜破壊試験のことです。半導体の酸化膜に電圧を継続的にかけると、時間が経つにつれ電氣的絶縁のために必要とされる酸化膜の破壊が発生します。この破壊時間を測定し、製品の絶縁寿命を見積もることができます。

絶縁油の温度は室温程度から最大200℃まで調整可能であり、高温環境中での加速試験も可能です。

自動測定モードでは、ロボットアームにより破壊したICへの高圧接続を自動切断します。

素子への印加電圧は交流、直流、いずれも選択することが可能です。

デジタルアイソレーター等、高い絶縁耐圧を必要とする素子の絶縁寿命の評価に最適です。

型式 IF-TD101

方式 油中電圧印加

最大同時測定素子数 96素子

温度範囲 RT+10℃～200℃

温度均一度 ±3℃

温度制御 油中ヒーター

最大電圧 AC20kVrms または DC20kV

破壊検出方法 電流検出

自動測定モード 破壊素子への電圧をロボットアームにて切り離し

サイズ W1800 × D850 × H1850 (mm)

重量 600 kg

製造販売元

 株式会社 IFG

〒982-0261 宮城県仙台市青葉区折立1丁目15番10号

TEL : 022-226-1263 FAX : 022-226-2818

E-mail : info@ifg.jp



当社製品の詳細はこちら

<https://ifg.jp>